

多元正态分布均值向量和协差阵的检验

均值向量的检验

第三节 协差阵的检验



多元鑑计 第一节 引言

- 在单一变量的统计分析中,已经给出了正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的均值 μ 和方差 σ 的各种检验。对于多变量的正态总体 N_n (μ, Σ) ,各种实际问题同样要求对 μ 和 Σ 进行统计推断。
 - ∞例如,我们要考察全国各省、自治区和直辖市的社会经济发展 状况,与全国平均水平相比较有无显著性差异等,就涉及到多 元正态总体均值向量的检验问题等。
- 本章类似单一变量统计分析中的各种均值和方差的检验,相 应地给出多元统计分析中的各种均值向量和协差阵的检验。





- 其基本思想和步骤均可归纳为:
 - 第一,提出待检验的假设 H_0 和 H_1 ;
 - 第二,给出检验的统计量及其服从的分布;
 - 第三,给定检验水平,查统计量的分布表,确定相应的临界值,从而得到否定域;
 - 第四,根据样本观测值计算出统计量的值,看是否落入否定域中,以便对待判假设做出决策(拒绝或接受)。
- 在检验的过程中,关键在于对不同的检验给出不同的统计量, 而有关统计量的给出大多用似然比方法得到。由于多变量问 题的复杂性,本章只侧重于解释选取统计量的合理性,而不 给出推导过程,最后给出几个实例。
- 为了更好的说明检验过程中统计量的分布,本章还要介绍 $HotellingT^2$ 分布和Wilks分布的定义。



多元统计 第二节 均值向量的检验

- 单一变量检验的回顾及HotellingT²分布
- 一个正态总体均值向量的检验
- 三两个正态总体均值向量的检验
- 四多个正态总体均值向量的检验



一、单一变量检验的回顾及Hotelling T²分布

- 为了对多元正态总体均值向量作检验,首先需要给出 Hotelling T²分布的定义。
- 在单一变量的检验问题中,设 X_1, X_2, \dots, X_n 来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本,我们要检验假设

$$H_0: \mu = \mu_0; \quad H_1: \mu \neq \mu_0$$

= 当 σ^2 已知时,用统计量

$$z = \frac{(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma} \sqrt{n}$$
 (3.1)

其中, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i$ 为样本均值。当假设成立时, 统计量 z 服

从正态分布 $z \sim N(0,1)$,从而否定域为 $|z| > z_{\alpha/2}$, $z_{\alpha/2}$ 为 N(0,1)的上 $\alpha/2$ 分位点。



■ 当
$$\sigma^2$$
未知时,用 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2$ (3.2)

作为 σ^2 的估计量,用统计量:

$$t = \frac{(\overline{X} - \mu_0)}{S} \sqrt{n} \tag{3.3}$$

来做检验。当假设成立时,统计量t 服从自由度为n-1的t分布,从而否定域为 $|t| > t_{\alpha/2}(n-1)$, $t_{\alpha/2}(n-1)$ 为自由度为n-1的t分布上的 $\alpha/2$ 分位点。

■ 这里我们应该注意到,(3.3) 式可以表示为

$$t^{2} = \frac{n(\overline{X} - \mu)^{2}}{S^{2}} = n(\overline{X} - \mu)'(S^{2})^{-1}(\overline{X} - \mu)$$
 (3.4)

对于多元变量而言,可以将t分布推广为下面将要介绍的 Hotelling T^2 分布。



多元统计

■ 定义 3.1 设 $X \sim N_p(\mu, \Sigma)$, $S \sim W_p(n, \Sigma)$ 且 X与 S 相互独立, $n \geq p$,则称统计量 $T^2 = nX'S^{-1}X$ 的 分 布 为 非 中 心 Hotelling T^2 分 布 , 记 为 $T^2 \sim T^2(p, n, \mu)$ 。当 $\mu = 0$ 时,称 T^2 服从(中心) Hotelling T^2 分布。记为 $T^2(p, n)$ 。

由于这一统计量的分布首先由 Harold Hotelling 提出来的,故称为 Hotelling T^2 分布,值得指出的是,我国著名统计学家许宝禄先生在 1938 年用不同方法也导出 T^2 分布的密度函数,因表达式很复杂,故略去。



- 在单一变量统计分析中,若统计量 $t \sim t(n-1)$ 分布,则 $t^2 \sim F(1,n-1)$ 分布,即把 t 分布的统计量转化为 F 统计量来 处理,在多元统计分析中 T^2 统计量也具有类似的性质。
- 定理 3.1 若 $X \sim N_p(\mathbf{0}, \Sigma)$, $S \sim W_p(n, \Sigma)$ 且X与S相互独立, 令 $T^2 = nX'S^{-1}X$,则

$$\frac{n-p+1}{np}T^2 \sim F(p, n-p+1)$$
 (3.5)

在我们后面所介绍的检验问题中,经常会用到这一性质。



多元统计 二、一个正态总体均值向量的检验

■ 设 $X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)}$ 是来自p维正态总体 $N_p(\mu, \Sigma)$ 的样

本,且
$$\overline{X} = \frac{1}{n} \sum_{\alpha=1}^{n} X_{(\alpha)}$$
, $S = \sum_{a=1}^{n} (X_{(a)} - \overline{X})(X_{(a)} - \overline{X})'$ 。

(-) 协差阵 Σ 已知时均值向量的检验

 H_0 : $\mu = \mu_0$ (μ_0 为已知向量) H_1 : $\mu \neq \mu_0$

假设 H。成立,检验统计量为

$$T_0^2 = n(\bar{X} - \mu_0)' \Sigma^{-1}(\bar{X} - \mu_0) \sim \chi^2(p)$$
 (3.6)

给定检验水平 α , 查 χ^2 分布表使 $P\left\{T_0^2 > \chi_\alpha^2\right\} = \alpha$, 可确定 出临界值 χ_{α}^{2} ,再用样本值计算出 T_{0}^{2} ,若 $T_{0}^{2} > \chi_{\alpha}^{2}$,则否定 H_{0} , 否则接受 H_0 。



■ 这里要对统计量的选取做一些解释,为什么该统计量服从 $\chi^2(p)$ 分布。根据二次型分布定理知道,若 $X \sim N_p(\mathbf{0}, \Sigma)$,则 $X'\Sigma^{-1}X \sim \chi^2(p)$ 。显然,

$$T_0^2 = n(\overline{X} - \mu_0)' \Sigma^{-1} (\overline{X} - \mu_0)$$

$$= \sqrt{n}(\overline{X} - \mu_0)' \Sigma^{-1} \sqrt{n}(\overline{X} - \mu_0) \underline{\Delta} Y' \Sigma^{-1} Y$$
其中, $Y = \sqrt{n}(\overline{X} - \mu_0) \sim N_p(\mathbf{0}, \Sigma)$,因此,
$$T_0^2 = n(\overline{X} - \mu_0)' \Sigma^{-1} (\overline{X} - \mu_0) \sim \chi^2(p) .$$



(二) 协差阵 Σ 未知时均值向量的检验

 H_0 : $\mu = \mu_0$ (μ_0 为已知向量) H_1 : $\mu \neq \mu_0$

假设 H_0 成立,检验统计量为

$$\frac{(n-1)-p+1}{(n-1)p}T^2 \sim F(p, n-p)$$
 (3.7)

其中, $T^2 = (n-1)[\sqrt{n}(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}_0)'\mathbf{S}^{-1}\sqrt{n}(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}_0)]$

给定检验水平 α ,查F分布表,使 $P\left\{\frac{n-p}{(n-1)p}T^2 > F_{\alpha}\right\} = \alpha$,可

确定出临界值 F_{α} ,再用样本值计算出 T^{2} ,若 $\frac{n-p}{(n-1)p}T^{2} > F_{\alpha}$,

则否定 H_0 ,否则接受 H_0 。



■ 这里需要解释的是,当 Σ 未知时,自然想到要用样本协差阵 $\frac{1}{n-1}$ S取代 替 Σ ,因(n-1)S $^{-1}$ 是 Σ $^{-1}$ 的无偏估计量,而样本离差阵

$$\mathbf{S} = \sum_{a=1}^{n} (\mathbf{X}_{(a)} - \overline{\mathbf{X}})(\mathbf{X}_{(a)} - \overline{\mathbf{X}})' \sim W_{p}(n-1, \Sigma)$$

$$\sqrt{n}(\overline{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}_{0}) \sim N_{p}(\mathbf{0}, \Sigma)$$

由定义 3.1 知

$$T^{2} = (n-1)\left[\sqrt{n}(\overline{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}_{0})'\mathbf{S}^{-1}\sqrt{n}(\overline{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}_{0})\right] \sim T^{2}(p, n-p)$$

再根据 Hotelling T^2 分布的性质,所以

$$\frac{(n-1)-p+1}{(n-1)p}T^{2} \sim F(p, n-p)$$

在处理实际问题时,单一变量的检验和多变量检验可以联合使用,多元的检验具有概括和全面考察的特点,而一元的检验容易发现各变量之间的关系和差异,能给人们提供更多的统计分析信息。

多元统计 三、两个正态总体均值向量的检验

(一) 当协差阵相等时,两个正态总体均值向量的检验 设 $X_{(a)} = (X_{a1}, X_{a2}, \dots, X_{ap})'$, $a = 1, 2, \dots, n$,为来自p维 正态总体 $N_p(\mu_1, \Sigma)$ 的容量为 n 的样本; $\mathbf{Y}_{(a)} = (Y_{a1}, Y_{a2}, \dots, Y_{ap})'$, $a = 1, 2, \dots, m$, 为来自 p 维正 态总体 $N_p(\mu_2, \Sigma)$ 的容量为m的样本。两组样本相互独 立, n > p, m > p, 且 $\overline{\mathbf{X}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \mathbf{X}_{(i)}$, $\overline{\mathbf{Y}} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} \mathbf{Y}_{(i)}$ 。



1. 针对有共同已知协差阵的情形对假设

$$H_0$$
: $\mu_1 = \mu_2$ H_1 : $\mu_1 \neq \mu_2$

进行检验。

对此问题,假设 H_0 成立时,所构造的检验统计量为

$$T_0^2 = \frac{n \cdot m}{n + m} (\overline{\mathbf{X}} - \overline{\mathbf{Y}})' \mathbf{\Sigma}^{-1} (\overline{\mathbf{X}} - \overline{\mathbf{Y}}) \sim \chi^2(p)$$
 (3.8)

给出检验水平 α ,查 $\chi^2(p)$ 分布表使 $P\{T_0^2>\chi_\alpha^2\}=\alpha$,可确定出临界值 χ_α^2 ,再用样本值计算出 T_0^2 ,若 $T_0^2>\chi_\alpha^2$,则否定 H_0 ,否则接受 H_0 。



■ 这里,我们应该注意到,在单一变量统计中进行均值相等检验

所给出的统计量为

$$z = \frac{\overline{X} - \overline{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{m}}} \sim N(0, 1)$$

显然

$$z^{2} = \frac{(\overline{X} - \overline{Y})^{2}}{\sigma^{2}} = \frac{n \cdot m}{(n+m)\sigma^{2}} (\overline{X} - \overline{Y})^{2}$$
$$= \frac{n \cdot m}{n+m} (\overline{X} - \overline{Y})'(\sigma^{2})^{-1} (\overline{X} - \overline{Y}) \sim \chi^{2} (1)$$

此式恰为上边统计量当 p=1 时的情况,不难看出这里给出的检验统计量是单一变量检验情况的推广。

2. 针对有共同的未知协差阵的情形对假设

$$H_0$$
: $\mu_1 = \mu_2$ H_1 : $\mu_1 \neq \mu_2$

进行检验。

对此问题,假设 H_0 成立时,所构造的检验统计量为

$$F = \frac{(n+m-2)-p+1}{(n+m-2)p}T^2 \sim F(p,n+m-p-1)$$
(3.9)

其中,



$$T^{2} = (n+m-2) \left[\sqrt{\frac{n \cdot m}{n+m}} (\overline{\mathbf{X}} - \overline{\mathbf{Y}}) \right]' \mathbf{S}^{-1} \left[\sqrt{\frac{n \cdot m}{n+m}} (\overline{\mathbf{X}} - \overline{\mathbf{Y}}) \right]$$

$$\mathbf{S} = \mathbf{S}_x + \mathbf{S}_y$$

$$\mathbf{S}_{x} = \sum_{a=1}^{n} (\mathbf{X}_{(a)} - \overline{\mathbf{X}})(\mathbf{X}_{(a)} - \overline{\mathbf{X}})'$$
, $\overline{\mathbf{X}} = (\overline{\mathbf{X}}_{1}, \overline{\mathbf{X}}_{2}, \dots, \overline{\mathbf{X}}_{p})'$

$$\mathbf{S}_{y} = \sum_{a=1}^{n} (\mathbf{Y}_{(a)} - \overline{\mathbf{Y}})(\mathbf{Y}_{(a)} - \overline{\mathbf{Y}})', \qquad \overline{\mathbf{Y}} = (\overline{\mathbf{Y}}_{1}, \overline{\mathbf{Y}}_{2}, \dots, \overline{\mathbf{Y}}_{p})'$$

给定检验水平 α ,查F分布表,使 $p\{F>F_{\alpha}\}=\alpha$,可确定出临界值 F_{α} ,再用样本值计算出F,若 $F>F_{\alpha}$,则否定 H_{0} ,否则接受 H_{0} 。



■ 这里我们需要解释的是,当两个总体的协差阵未知时,自然想到用每个总 体的样本协差阵 $\frac{1}{n-1}$ S_x 和 $\frac{1}{m-1}$ S_y 去代替,而

$$\mathbf{S}_{x} = \sum_{a=1}^{n} (\mathbf{X}_{(a)} - \overline{\mathbf{X}})(\mathbf{X}_{(a)} - \overline{\mathbf{X}})' \sim W_{p}(n-1, \Sigma)$$

$$\mathbf{S}_{y} = \sum_{a=1}^{m} (\mathbf{Y}_{(a)} - \overline{\mathbf{Y}})(\mathbf{Y}_{(a)} - \overline{\mathbf{Y}})' \sim W_{p}(m-1, \Sigma)$$

从而 $S = S_x + S_v \sim W_p(n+m-2, \Sigma)$ 。又由于

$$\sqrt{\frac{n \cdot m}{n+m}} (\overline{\mathbf{X}} - \overline{\mathbf{Y}}) \sim N_p(\mathbf{0}, \mathbf{\Sigma})$$

所以

$$\frac{(n+m-2)-p+1}{(n+m-2)p}T^2 \sim F(p, n+m-p+1)$$

下述假设检验统计量的选取和前边统计量的选取思路是一样的,以下只提 出待检验的假设,然后给出统计量及其分布,为节省篇幅,不做重复解释。



(二) 协差阵不等时,两个正态总体均值向量的检验设从两个总体 $N_p(\mathbf{\mu}_1, \mathbf{\Sigma}_1)$ 和 $N_p(\mathbf{\mu}_2, \mathbf{\Sigma}_2)$ 中,分别抽取两个样本,即 $\mathbf{X}_{(a)} = (\mathbf{X}_{a1}, \mathbf{X}_{a2}, \cdots, \mathbf{X}_{ap})'$, $a = 1, 2, \cdots, n$; $\mathbf{Y}_{(a)} = (\mathbf{Y}_{a1}, \mathbf{Y}_{a2}, \cdots, \mathbf{Y}_{ap})'$, $a = 1, 2, \cdots, m$,其容量分别为 n 和 m ,且两组样本相互独立, n > p, m > p , $\mathbf{\Sigma}_1 > 0$, $\mathbf{\Sigma}_2 > 0$ 。 对假设

$$H_0$$
: $\mu_1 = \mu_2$ H_1 : $\mu_1 \neq \mu_2$

进行检验。



1. 针对n = m的情形

$$\begin{array}{ll}
\mathbf{T} \cdot \mathbf{Y} \cdot \mathbf{Y} \cdot \mathbf{Y} = \mathbf{M} \cdot \mathbf{H} \cdot \mathbf{Y} \\
\mathbf{Z} \cdot \mathbf{Z}_{(i)} &= \mathbf{X}_{(i)} - \mathbf{Y}_{(i)} & i = 1, 2, \dots, n \\
\\
\mathbf{Z} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \mathbf{Z}_{(i)} &= \mathbf{X} - \mathbf{Y} \\
\mathbf{S} &= \sum_{i=1}^{n} (\mathbf{Z}_{(i)} - \mathbf{Z})(\mathbf{Z}_{(i)} - \mathbf{Z})' \\
&= \sum_{i=1}^{n} (\mathbf{X}_{(i)} - \mathbf{Y}_{(i)} - \mathbf{X} + \mathbf{Y})(\mathbf{X}_{(i)} - \mathbf{Y}_{(i)} - \mathbf{X} + \mathbf{Y})'
\end{array}$$

假设 H_0 成立时,构造检验统计量为

$$F = \frac{(n-p)n}{p} \overline{\mathbf{Z}}' \mathbf{S}^{-1} \overline{\mathbf{Z}} \sim F(p, n-p)$$
 (3.10)



2. 针对 *n* ≠ *m* 的情形

在此,我们不妨假设n < m,令

$$\mathbf{Z}_{(i)} = \mathbf{X}_{(i)} - \sqrt{\frac{n}{m}} \mathbf{Y}_{(i)} + \frac{1}{\sqrt{n \cdot m}} \sum_{j=1}^{n} \mathbf{Y}_{(i)} - \frac{1}{m} \sum_{j=1}^{n} \mathbf{Y}_{(i)}$$

$$i = 1, 2, \dots, n$$

$$\overline{\mathbf{Z}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \mathbf{Z}_{(i)} = \overline{\mathbf{X}} - \overline{\mathbf{Y}}$$



$$\mathbf{S} = \sum_{i=1}^{n} (\mathbf{Z}_{(i)} - \overline{\mathbf{Z}})(\mathbf{Z}_{(i)} - \overline{\mathbf{Z}})'$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \left[(\mathbf{X}_{(i)} - \overline{\mathbf{X}}) - \sqrt{\frac{n}{m}} (\mathbf{Y}_{(i)} - \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} \mathbf{Y}_{(j)}) \right]$$

$$\cdot \left[(\mathbf{X}_{(i)} - \overline{\mathbf{X}}) - \sqrt{\frac{n}{m}} (\mathbf{Y}_{(i)} - \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} \mathbf{Y}_{(j)}) \right]'$$

假设 H_0 成立时,构造检验统计量为

$$F = \frac{(n-p)n}{p} \overline{\mathbf{Z}}' \mathbf{S}^{-1} \overline{\mathbf{Z}} \sim F(p, n-p)$$
 (3.11)



四、多个正态总体均值向量的检验

■ 解决多个正态总体均值向量的检验问题,实际上应用到多元方差分析的知识。多元方差分析是单因素方差分析直接的推广。为了容易理解多元方差分析方法,我们有必要先回顾单因素方差分析方法。(一)单因素方差分析的基本思想及 Wilks 分布设 k 个正态总体分别为 $N(\mu_1, \sigma^2)$, …, $N(\mu_k, \sigma^2)$, 从 k 个总体取 n_i 个独立样本如下:

$$X_1^{(1)}, X_2^{(1)}, \cdots, X_{n_1}^{(1)}$$
 \dots
 $X_1^{(k)}, X_2^{(k)}, \cdots, X_{n_k}^{(k)}$

 H_0 : $\mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_k$ H_1 : 至少存在 $i \neq j$ 使 $\mu_i \neq \mu_j$ 假设 H_0 成立时,构造检验统计量为

$$F = \frac{SSA/(k-1)}{SSE/(n-k)} \sim F(k-1, n-k)$$
 (3.11)



■ 这里 $SSA = \sum_{i=1}^{k} n_i (\bar{X}_i - \bar{X})^2$ 称为组间平方和; $SSE = \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{n_i} (X_j^{(i)} - \bar{X}_i)^2$

称为组内平方和; $SST = \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{n_i} (X_j^{(i)} - \bar{X})^2$ 称为总平方和。其中

$$\bar{X}_i = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^n X_j^{(i)}$$

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{n_i} X_j^{(i)}$$
 $n = n_1 + \dots + n_k$

给定检验水平 α ,查F分布表,使 $p\{F>F_{\alpha}\}=\alpha$,可确定出临界值 F_{α} ,再用样本值计算出F值,若 $F>F_{\alpha}$,则否定 H_{0} ,否则接受 H_{0} 。



- 定义 3.2 若 $\mathbf{X} \sim N_p(\mathbf{0}, \mathbf{\Sigma})$,则称协差阵的行列式 $|\mathbf{\Sigma}|$ 为 \mathbf{X} 的广义 方差。称 $|\mathbf{0}, \mathbf{\Sigma}|$ 为样本广义方差。其中 $\mathbf{S} = \sum_{a=1}^{n} (\mathbf{X}_{(a)} \overline{\mathbf{X}})(\mathbf{X}_{(a)} \overline{\mathbf{X}})'$ 。
- 定义 3.3 若 $\mathbf{A}_1 \sim W_p(n_1, \mathbf{\Sigma}), n_1 \geq p$, $\mathbf{A}_2 \sim W_p(n_2, \mathbf{\Sigma}), \mathbf{\Sigma} > 0$,且 \mathbf{A}_1 和 \mathbf{A}_2 ,相互独立,则称

$$\Lambda = \frac{\left| \mathbf{A}_1 \right|}{\left| \mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2 \right|}$$

为 Wilks 统计量, Λ 的分布称为 Wilks 分布, 简记为 $\Lambda \sim \Lambda(p, n_1, n_2)$,其中 n_1 , n_2 为自由度。

■ 这里我们需要说明的是,在实际应用中经常把 Λ 统计量化为 T^2 统计量进而化为 F 统计量,利用 F 统计量来解决多元统计分析中有关检验问题。表 3.1 列举常见的一些情形。



表 3.1 Λ 与 F 统计量的关系			
p	$n_{\scriptscriptstyle 1}$	n_2	F 统计量及分别
任意	任意	1	$\frac{n_{1}-p+1}{p} \cdot \frac{1-\Lambda(p,n_{1},1)}{\Lambda(p,n_{1},1)} \sim F(p,n_{1}-p+1)$
任意	任意	2	$\frac{n_1-p}{p} \cdot \frac{1-\sqrt{\Lambda(p,n_1,2)}}{\sqrt{\Lambda(p,n_1,2)}} \sim F(2p,2(n_1-p))$
1	任意	任意	$\frac{n_1}{n_2} \cdot \frac{1 - \Lambda(1, n_1, n_2)}{\Lambda(1, n_1, n_2)} \sim F(n_2, n_1)$
2	任意	任意	$\frac{n_1 - 1}{n_2} \cdot \frac{1 - \sqrt{\Lambda(2, n_1, n_2)}}{\sqrt{\Lambda(2, n_1, n_2)}} \sim F(2n_2, 2(n_1 - 1))$

以上几个关系式说明对一些特殊的 Λ 统计量可以化为 F 统计量,而当 $n_2 > 2$, p > 2 时,可用 χ^2 统计量或 F 统计量来近似表示,后面给出。



(二) 多元方差分析法

设有 $k \wedge p$ 维正态总体 $N_p(\mathbf{\mu}_1, \mathbf{\Sigma})$, …, $N_p(\mathbf{\mu}_k, \mathbf{\Sigma})$, 从每个总体抽取独立样本个数分别为 n_1, n_2, \dots, n_k , $n_1 + \dots + n_k = n$, 每个样品观测p 个指标得观测数据如下:

第一个总体:
$$\mathbf{X}_{i}^{(1)} = (X_{i1}^{(1)}, X_{i2}^{(1)}, \dots, X_{ip}^{(1)})$$
, $i = 1, 2, \dots, n_1$

第二个总体:
$$\mathbf{X}_{i}^{(2)} = (X_{i1}^{(2)}, X_{i2}^{(2)}, \dots, X_{ip}^{(2)})$$
, $i = 1, 2, \dots, n_2$

•••••

第k个总体: $\mathbf{X}_{i}^{(k)} = (X_{i1}^{(k)}, X_{i2}^{(k)}, \dots, X_{ip}^{(k)})$, $i = 1, 2, \dots, n_{k}$

全部样品的总均值向量:

$$\overline{\mathbf{X}}_{1\times p} = \frac{1}{n} \sum_{r=1}^{k} \sum_{i=1}^{n_r} \mathbf{X}_{\mathbf{i}}^{(r)} = (\overline{\mathbf{X}}_1, \overline{\mathbf{X}}_2, \dots, \overline{\mathbf{X}}_p)$$



■ 各总体样品的均值向量:

$$\bar{\mathbf{X}}_{1\times p}^{(r)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n_r} \mathbf{X}_i^{(r)} \underline{\underline{\Delta}}(\bar{\mathbf{X}}_1^{(r)}, \bar{\mathbf{X}}_2^{(r)}, \cdots, \bar{\mathbf{X}}_p^{(r)}), \quad r = 1, 2, \cdots, k$$

此处

$$\bar{\mathbf{X}}_{j}^{(r)} = \frac{1}{n_{r}} \sum_{i=1}^{n_{r}} X_{ij}^{(r)}$$

类似一元方差分析办法,将诸平方和变成了离差阵即:

$$\mathbf{A} = \sum_{r=1}^{k} n_r (\overline{\mathbf{X}}^{(r)} - \overline{\mathbf{X}})' (\overline{\mathbf{X}}^{(r)} - \overline{\mathbf{X}})$$

$$\mathbf{E} = \sum_{r=1}^{k} \sum_{i=1}^{n_r} (\overline{\mathbf{X}}_i^{(r)} - \overline{\mathbf{X}}^{(r)})' (\overline{\mathbf{X}}_i^{(r)} - \overline{\mathbf{X}}^{(r)})$$

$$\mathbf{T} = \sum_{r=1}^{k} \sum_{i=1}^{n_r} (\overline{\mathbf{X}}_i^{(r)} - \overline{\mathbf{X}})' (\overline{\mathbf{X}}_i^{(r)} - \overline{\mathbf{X}})$$

这里,我们称 A 为组间离差阵; E 为组内离差阵; T 为总离差阵。很显然有 T = A + E。



■ 我们的问题是检验假设

 H_0 : $\mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_k$ H_1 : 至少存在 $i \neq j$ 使 $\mu_i \neq \mu_j$ 用似然比原则构成的检验统计量为

$$\Lambda = \frac{|\mathbf{E}|}{|\mathbf{T}|} = \frac{|\mathbf{E}|}{|\mathbf{A} + \mathbf{E}|} \sim \Lambda(p, n - k, k - 1)$$
 (3.13)

给定检验水平 α ,查 Wilks 分布表,确定临界值,然后作出统计判断。在这里我们特别要注意,Wilks 分布表可用 χ^2 分布或 F 分布来近似。

巴特莱特 (Bartlett) 提出了用 χ^2 分布来近似。设 $\Lambda \sim \Lambda(p, n, m)$,令

$$V = -(n+m-(p+m+1)/2) \ln \Lambda = \ln \Lambda^{1/t}$$
 (3.14)
则 V 近似服从 $\chi^2(pm)$ 分布。其中, $t = n+m-(p+m+1)/2$ 。



■ Rao 后来又研究用 F 分布来近似。设 $\Lambda \sim \Lambda(p, n, m)$,令

$$R = \frac{1 - \Lambda^{1/L}}{\Lambda^{1/L}} \cdot \frac{tL - 2\lambda}{pm}$$
 (3.15)

则 R 近似服从 $F(pm,tL-2\lambda)$,这里 $tL-2\lambda$ 不一定为整数 , 可用 与它最近的整数 来作为 F 的 自由度,且 min(p,m) > 2 。其中,

$$t = n + m - (p + m + 1)/2$$

$$L = \left(\frac{p^2 m^2 - 4}{p^2 + m^2 - 5}\right)^{1/2}$$

$$\lambda = \frac{pm - 2}{4}$$



多远缝计 第三节 协差阵的检验

一一个正态总体协差阵的检验

三多个协差阵相等检验





多远统计一、一个正态总体协差阵的检验

以 X_(a) = $(X_{a1}, X_{a2}, \dots, X_{ap})'$ $(a = 1, 2, \dots, n)$ 来自 p 维正态总体 $N_p(\mu, \Sigma)$ 的样本, Σ 未知,且 $\Sigma > 0$ 。

首先,我们考虑检验假设

$$H_0$$
: $\Sigma = \mathbf{I}_p$

$$H_1: \Sigma \neq \mathbf{I}_p$$

所构造的检验统计量为

$$\lambda = \exp\left\{-\frac{1}{2}tr\mathbf{S}\right\} |\mathbf{S}|^{n/2} \left(\frac{e}{n}\right)^{np/2}$$

(3.16)

$$\mathbf{S} = \sum_{a=1}^{n} (\mathbf{X}_{(a)} - \overline{\mathbf{X}})(\mathbf{X}_{(a)} - \overline{\mathbf{X}})'$$

然后,我们考虑检验假设

$$H_0: \ \Sigma = \Sigma_0 \neq I_p \qquad H_1: \ \Sigma \neq \Sigma_0 \neq I_p$$

$$H_1: \ \Sigma \neq \Sigma_0 \neq I_p$$

因为 $\Sigma_0 > 0$,所以存在 $\mathbf{D}(|\mathbf{D}| \neq 0)$,使得 $\mathbf{D}\Sigma_0 \mathbf{D}' = \mathbf{I}_n$ 。



$$\mathbf{Y}_{(a)} = \mathbf{D}\mathbf{X}_{(a)}$$
 $a = 1, 2, \dots, n$

$$a=1,2,\cdots,n$$

$$\mathbf{Y}_{(a)} \sim N_p(\mathbf{D}\boldsymbol{\mu}, \mathbf{D}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{D}') = N_p(\boldsymbol{\mu}^*, \boldsymbol{\Sigma}^*)$$

因此,检验 $\Sigma = \Sigma_0$ 等价于检验 $\Sigma^* = \Gamma_n$

此时构造检验统计量为

$$\lambda = \exp\left\{-\frac{1}{2}tr\mathbf{S}^*\right\} \left|\mathbf{S}^*\right|^{n/2} \left(\frac{e}{n}\right)^{np/2}$$

(3.17)

其中

$$\mathbf{S}^* = \sum_{a=1}^n (\mathbf{Y}_{(a)} - \overline{\mathbf{Y}})(\mathbf{Y}_{(a)} - \overline{\mathbf{Y}})'$$

给定检验水平 α ,因为直接由 λ 分布计算临界值 λ 。很困难,所以通常采 用 λ 的近似分布。

在 H_0 成立时, $-2\ln\lambda$ 极限分布是 $\chi^2_{p(p+1)/2}$ 分布。因此当n>>p,由样

本值计算出 λ 值,若 $-2\ln\lambda > \chi^2$ 即 $\lambda < e^{-\chi^2_{\alpha}/2}$,则拒绝 H_0 ,否则接受 H_0 。



多元统计 二、多个协差阵相等检验

■ 设有k个正态总体分别为 $N_p(\mathbf{\mu}_1, \mathbf{\Sigma}_1)$, …, $N_p(\mathbf{\mu}_k, \mathbf{\Sigma}_k)$, $\Sigma_i > 0$ 且未知, $i = 1, \dots, k$ 。从 k 个总体分别取 n_i 个样本

$$\mathbf{X}_{(a)}^{(i)} = (X_{a1}^{(i)}, X_{a2}^{(i)}, \dots, X_{ap}^{(i)})'$$
 $i = 1, \dots, k ; a = 1, \dots, n_i$

这里 $\sum n_i = n$ 为总样本容量。

我们考虑检验假设

$$H_0$$
: $\Sigma_1 = \Sigma_2 = \cdots = \Sigma_k$

$$H_1$$
: $\{\Sigma_i\}$ 不全相等



■ 构造检验统计量为

$$\lambda_k = n^{np/2} \prod_{i=1}^k |\mathbf{S}_i|^{n_i/2} / |\mathbf{S}|^{n/2} \prod_{i=1}^k n_i^{pn_i/2}$$
 (3.18)

其中

$$\mathbf{S} = \sum_{i=1}^{k} \mathbf{S}_{i}$$

$$\mathbf{S}_{i} = \sum_{\alpha=1}^{n_{i}} (X_{(a)}^{(i)} - \overline{\mathbf{X}}^{(i)})(X_{(a)}^{(i)} - \overline{\mathbf{X}}^{(i)})'$$

$$\overline{\mathbf{X}}^{(i)} = \frac{1}{n_{i}} \sum_{\alpha=1}^{n_{i}} \mathbf{X}_{(a)}^{(i)}$$



巴特莱特 (Bartlett) 建议 ,将 n_i 改为 n_i — 1,从而 n 变为 n - k , 变换以后的 λ_k 记为 λ_k' ,称为修正的统计量,则 — 2 ln λ_k' 近似分布 $\chi_f^2/(1-\mathbf{D})$ 。 其中

$$f = \frac{1}{2}p(p+1)(k-1)$$

$$\mathbf{D} = \begin{cases} \frac{2p^2 + 3p - 1}{6(p+1)(k-1)} \left(\sum_{i=1}^{k} \frac{1}{n_i - 1} - \frac{1}{n-k} \right), & \text{至少有一对} \quad n_i \neq n_j \\ \frac{(2p^2 + 3p - 1)(k+1)}{6(p+1)(n-k)}, & n_1 = n_2 = \dots = n_k \end{cases}$$



本章结束



